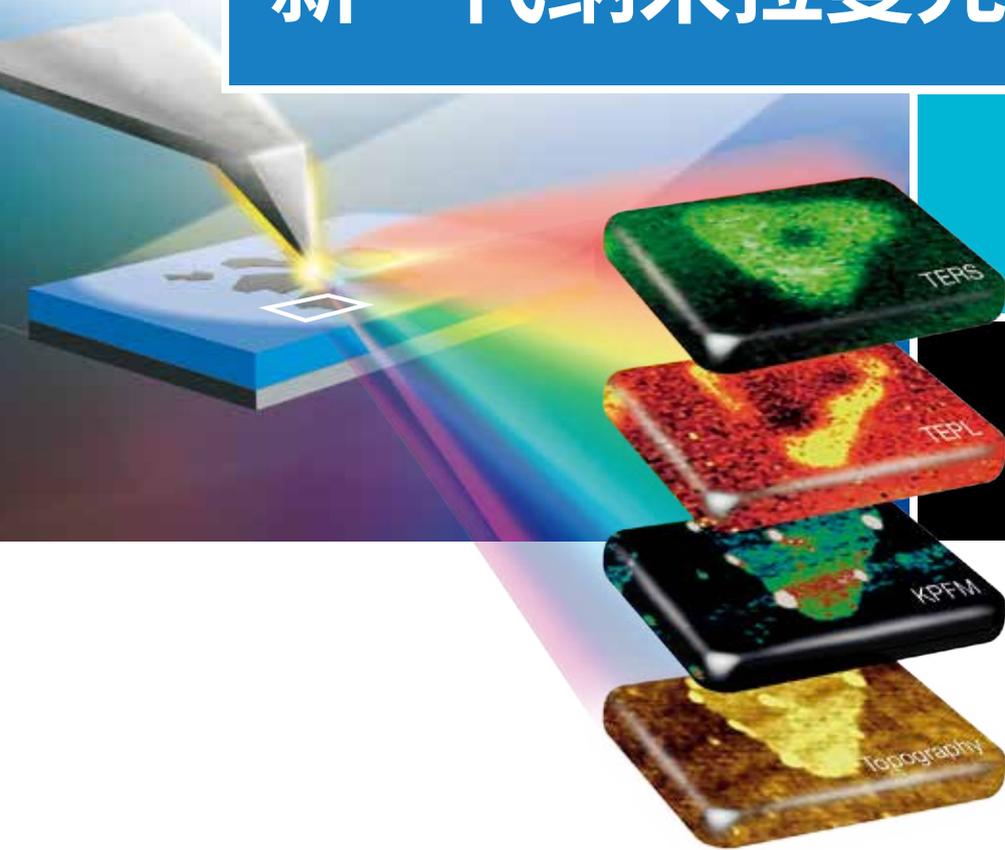
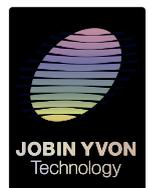


新一代纳米拉曼光谱仪



AFM-Raman, TERS, SNOM,
纳米光谱测量系统



简介

随着扫描探针显微镜 (SPM) 在二十世纪八十年代的出现，大气环境中的纳米尺度成像成为了可能。该技术使材料表面各种物理特性的表征得以快速持续的发展，然而如何实现纳米尺度的化学结构表征仍是一项挑战。

拉曼光谱为分子结构和化学组分分析提供了有效的解决方案，广泛应用于材料科学和生命科学领域。但是这种方法的空间分辨率在很大程度上受限于光学衍射极限。

因此，将这两种技术结合是富有吸引力和挑战性的，打开我们进入纳米光学世界的窗口。在该领域，HORIBA Scientific 通过几十年的经验积累和努力，开发了一套纳米拉曼的整体解决方案，使其成为一个通用且功能强大、使用简便、快速可靠的分析工具。

HORIBA 纳米拉曼光谱仪

重要特征

- **多种样品分析平台**
高分辨样品扫描器，扫描样品面积从纳米尺寸至样品台极限
- **简便易操作**
全自动操作，大大缩短了测试时间
- **真共聚焦**
高空间分辨率，自动成像平台，多种显微镜可视观察系统
- **高灵敏度**
仅配置三面反射镜，灵敏度和光通量得到显著提高，提高设备稳定性
- **高光谱分辨率**
多光栅自动切换，宽的光谱范围用于拉曼和 PL 测试
- **纳米尺度空间分辨率**
通过针尖增加拉曼光谱 (TERS) 成像，实现 20 nm 的空间分辨率
- **多种测试模式 / 多种环境**
多种 SPM 模式，包括 AFM、导电 AFM、开尔文、STM 模式，可以在液体和电化学环境下测试，通过 TERS 和 TEPL 技术，可同时获得化学信息成像
通过一台电脑即可控制所有功能。另外，SPM 和光谱仪也可以单独控制使用
- **稳定性**
采用新一代 15 KHz 高频调制 SPM 扫描器，远离生活噪声，具有高信噪比和稳定性
- **灵活性**
具有顶部、底部、侧向等多个方向拉曼探测能力，满足各方面应用研究需求
原子力显微镜和激光拉曼均来自 HORIBA 公司法国工厂，并且提供原子力显微镜与光谱一体软件，确保设备性能和售后

用户故事 TERS 的领导者

十几年前，HORIBA Scientific 与法国国家科学研究院联合研发了第一套 TERS 原型机，并成功的将该系统商业化。该套系统的特色是将 STM 和 AFM 各模式相结合，增加了拉曼背散射中侧向照明。因其出色的性能和操作简单，它被成功的应用到各类材料和纳米结构的表征，如自组装有机单分子层，碳纳米管，功能化半导体材料。该套系统在科研领域取得丰硕成果，向全世界展示了 TERS 系统的应用。几十年来，在 TERS 原型机的基础上，HORIBA 科学仪器部全新开发的基于模块化的 TERS 系统，能够实现 SPM 的所有模式 (STM、AFM、TF 等)，可以实现从顶部，侧向和底部耦合，法国国家科学研究院的纳米拉曼团队用 HORIBA 全新开发的纳米拉曼系统，获取了更多维度的测试数据，这套设备不仅满足当下课题的研究需求，而且还开创了新的研究领域。

Razvigor Ossikovski 教授
法国国家科学研究院纳米拉曼
负责人



强有力的物理、化学结构表征工具

功能强大

- 可同时进行 SPM 和拉曼光谱测试
- 顶部和侧向均可使用高数值孔径 $\times 100$ 物镜，使得同区域测量能获得更高的空间分辨率，针尖增强拉曼 (TERS) 具有高的信号收集效率
- 通过 SWIFT XS 和 EMCCD 探测器可以实现高通量信号收集能力和快速扫描速度
- 宽光谱范围：从深紫外到近红外
- 可选配 HORIBA 拉曼光谱仪系统以获得高光谱性能



1300 nm AFM 激光反馈：对拉曼信号不产生干扰



顶部和侧向配 $100\times$ 高数值孔径物镜，提高灵敏度和空间分辨率



简便易操作：更换针尖不需要移动样品或改变光路



激光自动准直



XYZ 物镜扫描器，将拉曼激光耦合到针尖尖端，移动范围 $30\times 30\times 15\mu\text{m}$



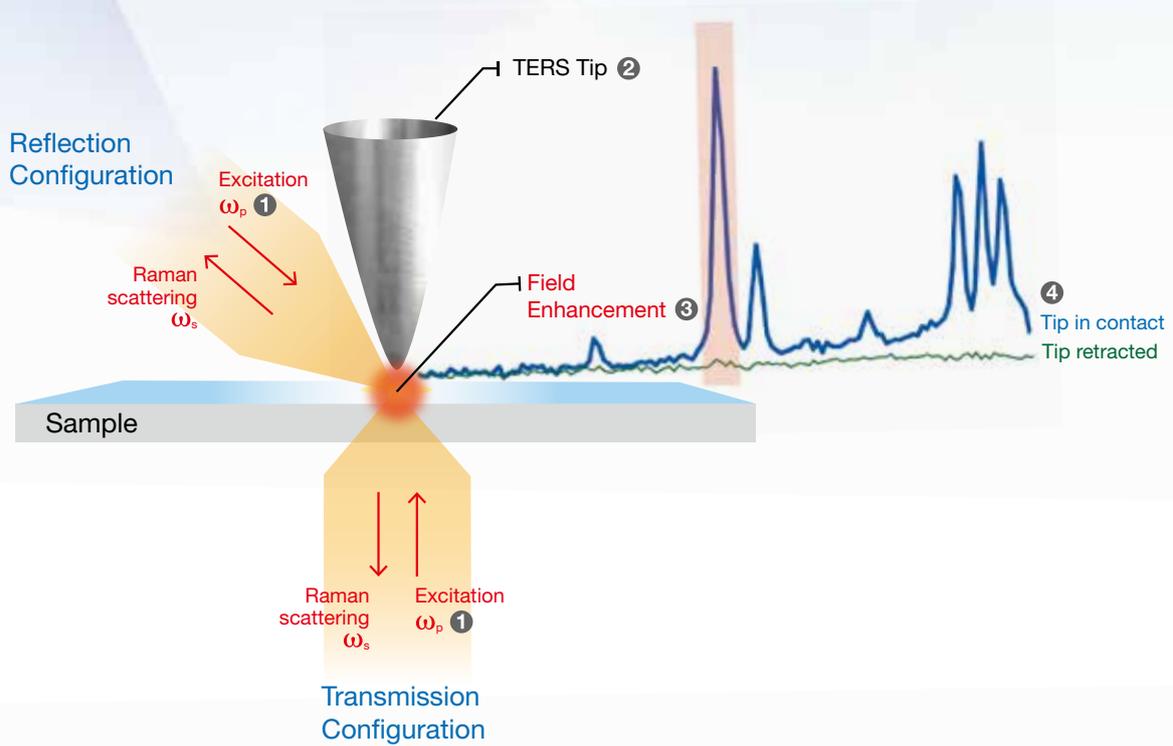
系统稳定：无需主动减震台

操作简单、快速！

- 一键完成“悬臂梁 - 参考激光”对准及调谐频率优化，无需手动调整
- 换针尖时无需移动样品，换完针尖后还能很容易回到原来样品位置
- 通过物镜扫描器自动完成拉曼激光与 TERS 针尖耦合
- 通过一台电脑即可完全控制



操作简单的



如何实现 TERS

在 TERS 系统，拉曼激光 ① 聚焦到镀有金或银的针尖末端 ②，选择合适的激发波长，在针尖十几纳米附近产生局域等离子体共振效应 ③，拉曼信号强度和局域电场成正比，增强的热点和样品接近就会显著地增强样品的拉曼信号，达到 10^5 或者 10^6 ④。

什么是同区域成像

拉曼和扫描探针显微镜可以耦联成为一套系统，同区域成像测试是在同一个区域内同时或者连续获得 AFM 图和拉曼成像图。

AFM 和其他的 SPM 技术如 STM，音叉模式（正交力和剪切力）可以提供表面形貌，力学性能，热学性能，电学和磁学性能以及分子分辨率测试，另一方面共焦拉曼光谱和成像提供材料的化学信息，受到空间分辨率的限制。

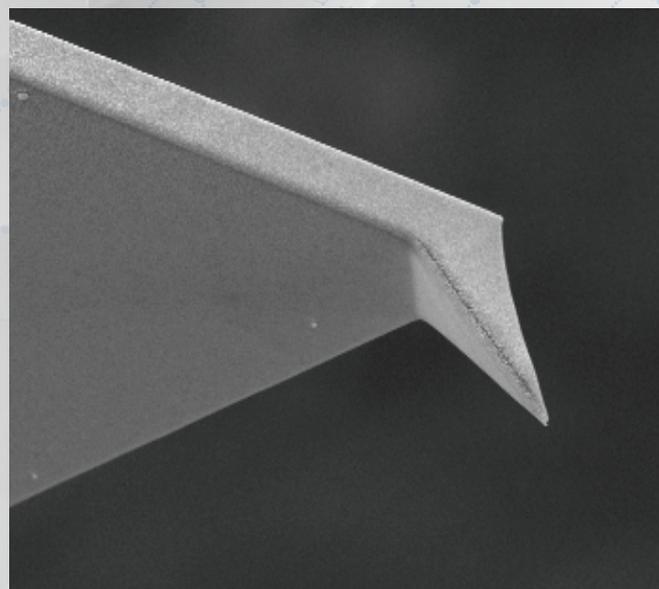
TERS 系统

稳定的 AFM-TERS 针尖

拉曼和扫描探针显微镜可以耦联成为一套系统，同 Omni™ 型号的 TERS 探针，可同时获取样品表面形貌和 TERS 光谱。

HORIBA NANO Raman 系统结合 Omni™ 的 TERS 针尖提供了理想的增强方案。Omni™ TERS 探针全面兼容 HORIBA XploRA Nano, LabRAM Odyssey Nano, LabRAM Soleil Nano, OmegaScope 和 TRIOS 系统。

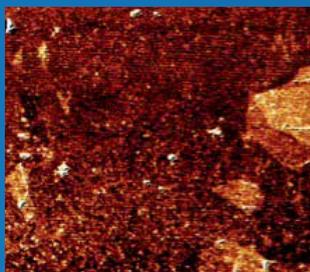
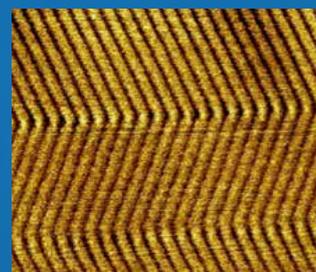
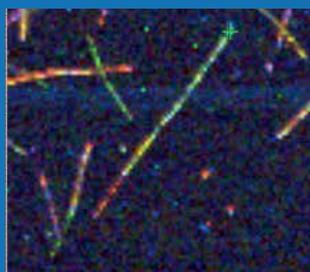
- 适用不同方向的 TERS 耦合：顶部、侧向和底部
- 多层结构：优化针尖，减少硅衬底光谱干扰
- 惰性气体包装延长针尖的使用寿命
- 具有特殊保护层的 Ag 针尖能够防止大气环境下氧化
- 兼容 TERS、TEPL 测试的激光器：532, 594, 633, 638, 671, 785 和 830nm



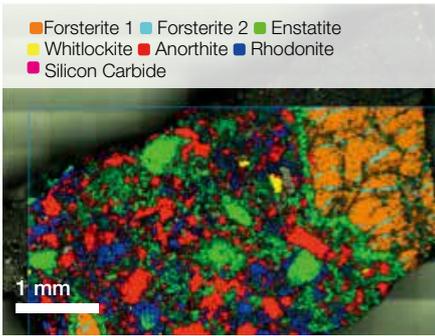
*Manufactured for HORIBA by APP NANO

可验证的 TERS 样品

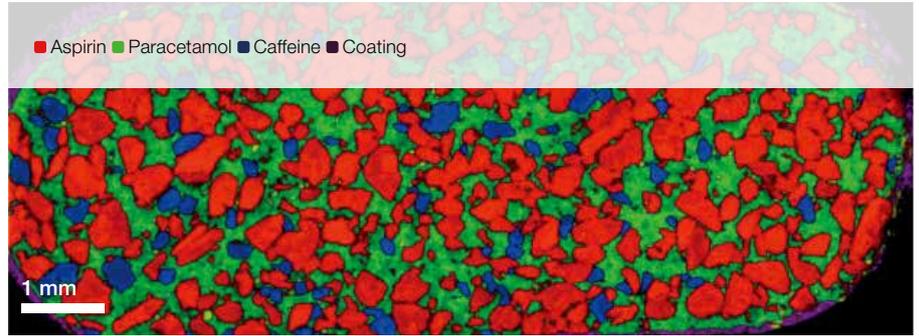
HORIBA 提供一系列的测试样品包括单壁碳纳米管和氧化石墨烯，适当的分散可以做 TERS 成像。样品用来展示 AFM 的分子分辨率，通过 TERS 成像展示 20 nm 的空间分辨率。可以 20nm 空间分辨率近场成像做验收条款。



大区域成像

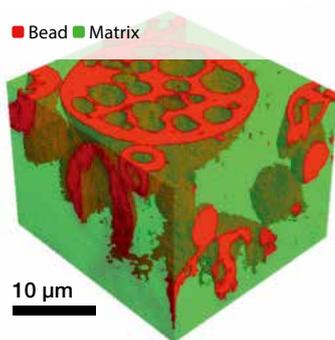


陨石切片拉曼成像

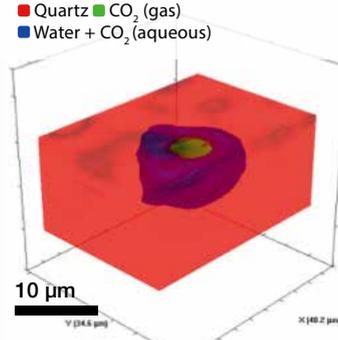


药片拉曼成像

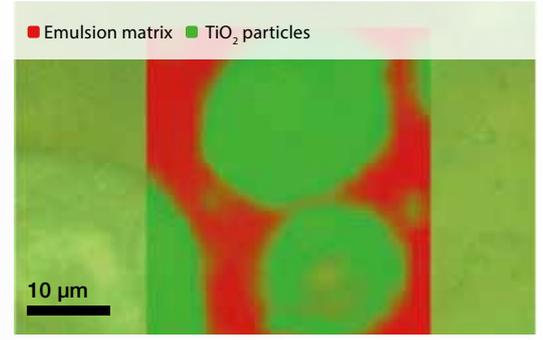
真共聚焦 -3D 成像



聚合物中包裹物的 3D 成像

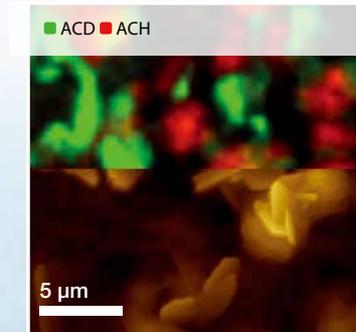


石英中 CO₂ 包裹体的 3D 成像



乳胶中的 TiO₂ 颗粒的拉曼成像

AFM 与 Ra



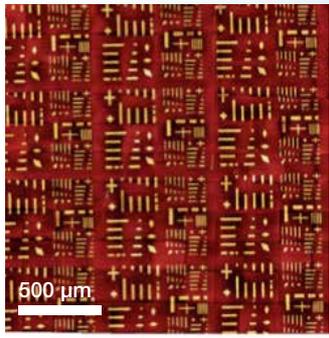
同区域油脂晶体的 AFM 和拉曼成像图

10⁻²m

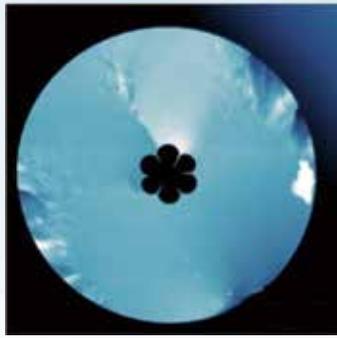
10⁻³m

1

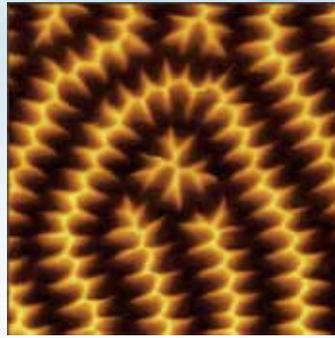
From Macro



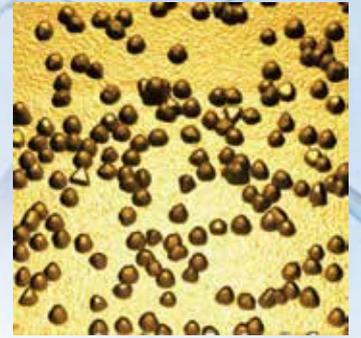
硅基底上 CoCr 的表面形貌图 (接触模式)



光纤 AFM 形貌像 -Top Mode

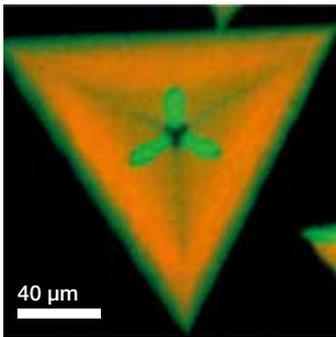


钇铁石榴石薄膜磁畴 -MFM

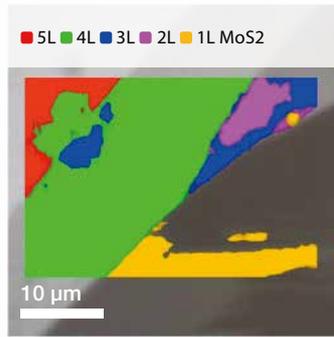


金纳米颗粒 AFM 形貌像 -150nm

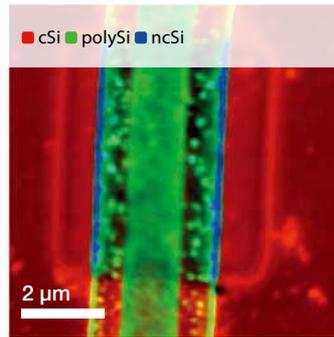
高光谱分辨率



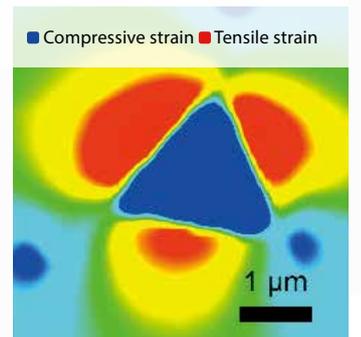
光致发光与拉曼成像 (WS_2)



不同层状 MoS_2 的拉曼成像 - 低波数 ($<30cm^{-1}$) 的层间振动峰

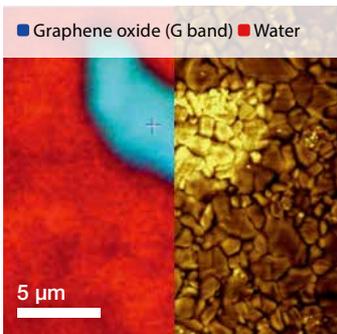


硅晶元上结晶硅、聚合硅和纳米硅的拉曼成像

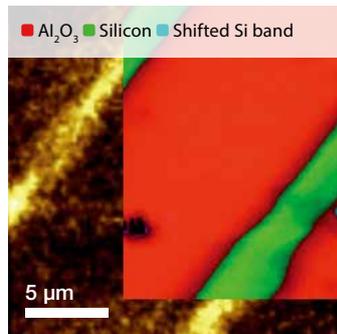


硅器件应力拉曼成像

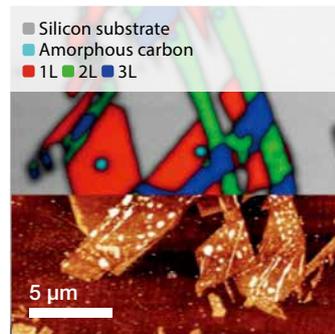
同区域成像



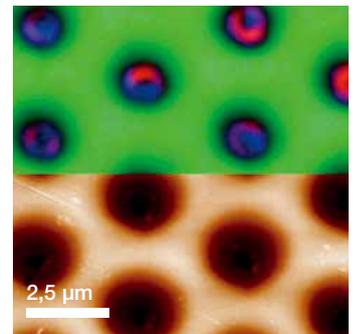
液体环境下氧化石墨烯的 AFM 和拉曼成像图



同区域内 Al_2O_3 衬底上硅结构的 AFM 和拉曼成像图



层状石墨烯的 AFM 和拉曼成像图



金膜衬底上信号分子功能化的孔阵列, AFM 和拉曼成像图

$0-4\mu m$

$10^{-5}\mu m$

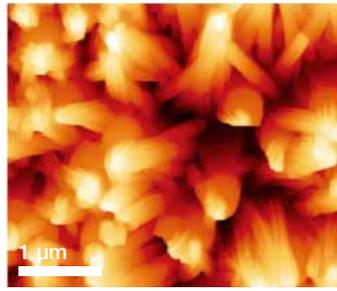
$10^{-6}\mu m$

... Micro...

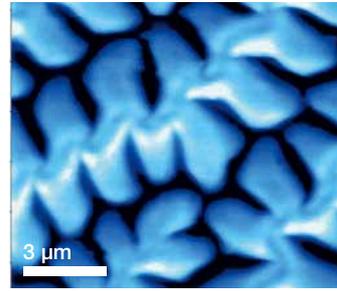
多种 SPM 测量模式



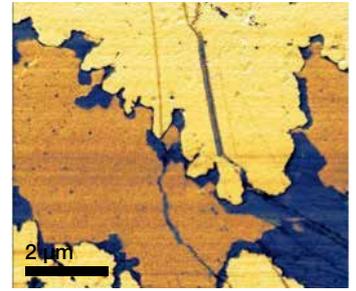
AFM - 芽孢杆菌营养细胞的 AFM 图



氧化锌纳米棒表面形貌图 -Z 方向高度差为 3.6 μm

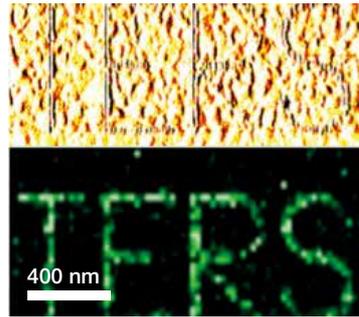


MFM - 钇铁石榴石膜表面磁畴结构成像

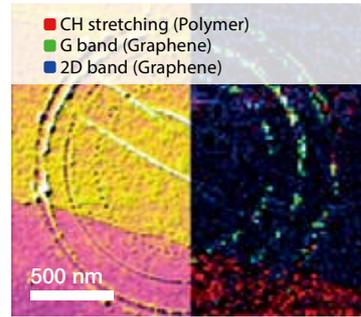


LFM-P3HT:PCBM - 富勒烯混合物表面摩擦力成像

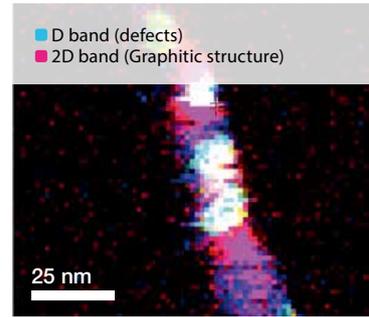
针尖增强拉曼光谱成像



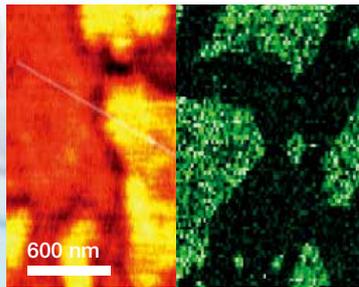
AFM 和 TERS 成像图 - 氧化石墨烯上刻划 TERS 字样



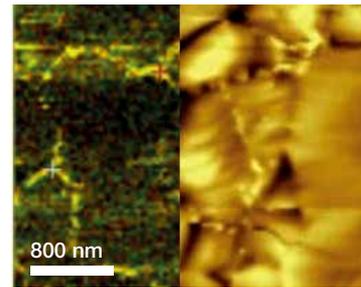
AFM 和 TERS 成像 - CVD 法生长的石墨烯转移后的印记



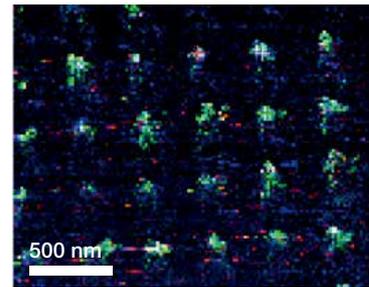
TERS 成像 - 金衬底上单根碳纳米管的 TERS 成像, 空间分辨率达 8 nm



KPFM 和 TERS 成像 - 金衬底上氧化石墨烯的表面电势和 TERS 成像图

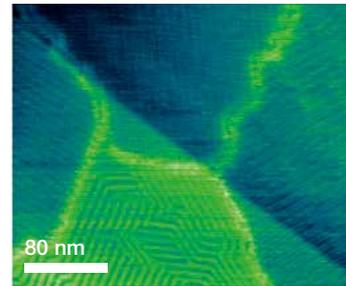


AFM 和 TERS 成像图 - 金衬底上自组装偶氮苯硫醇的表面形貌和 TERS 成像图



TERS 成像 - 自组装单层膜上 1,4 氨基硫酚

分子级别分辨

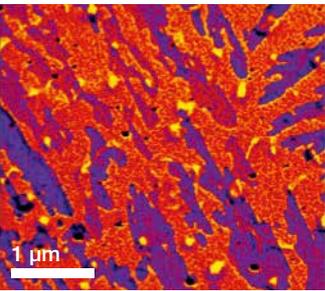


大气环境中峰花酸表面形貌图

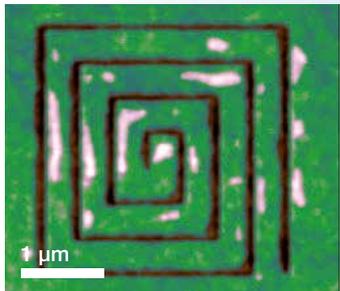
$10^{-6}m$

$10^{-7}m$

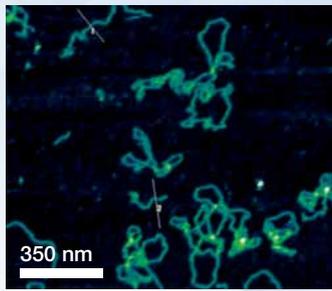
...Micro...



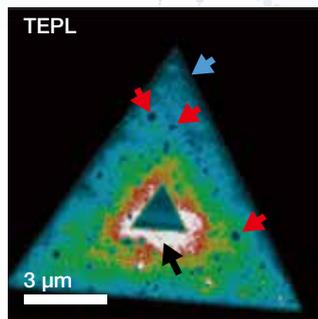
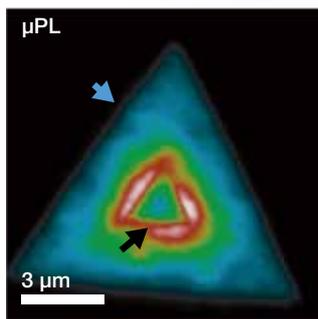
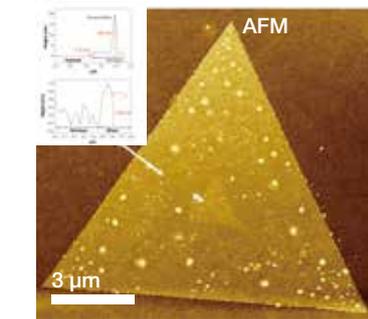
KPFM - 金膜上的 DTB 分子成像



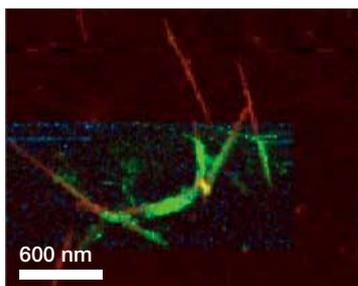
纳米刻蚀 - 聚碳酸酯上刻蚀试样



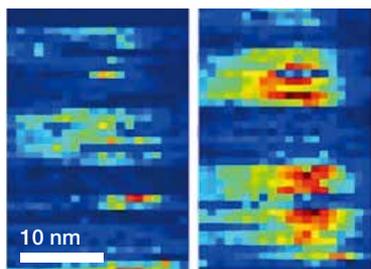
液体环境 AFM 测试 - 云母上的质粒 DNA



AFM 和 TEPL 成像 SiO₂/Si 基底上 WS₂ 纳米级结晶

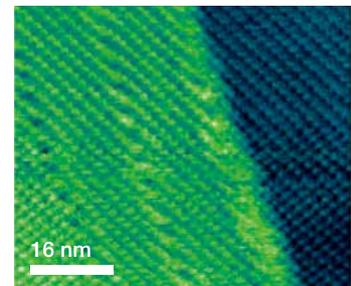


TERS和AFM图像叠加-玻璃衬底上碳纳米管的AFM图和TERS成像图叠加

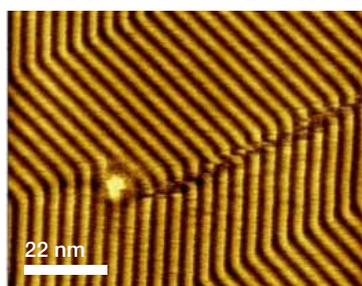


TERS 成像 - DNA 碱基对有序排列

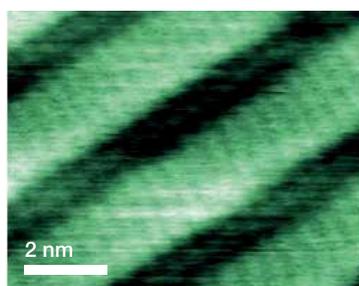
率成像



HOPG上胆甾醇硬脂酸酯的表面形貌图

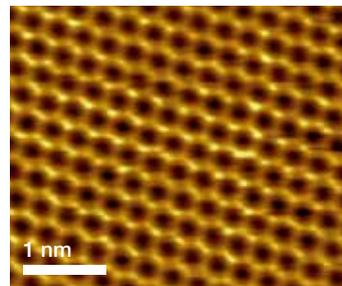


HOPG 上棕榈酸棕榈酸酯的表面形貌图



相邻环烷烃 (间隔约4Å)

原子分辨率



STM模式下HOPG样品的原子级分辨率

10⁻⁸m

10⁻⁹m

... To Nanoscopy!

集成化软件

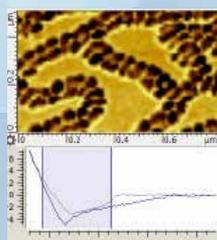
一个软件控制 HORIBA NANO Raman 的数据采集

主要特征

- **集成化软件:** 一个软件即可控制纳米拉曼整个平台 (包括单独 AFM、拉曼、光致发光、同区域成像测试和 TERS)
- **强大的 LabSpec6 软件:** 集成多变量分析模块, 一键完成 PCA, MCR, HCA, DCA 分析
- **Spec-top 成像模式:** Spec-top 为专门设计的特殊轻敲模式, 根据设置的步进轻敲样品, 这样既保留了针尖的尖锐度, 也提高了 TERS 信号的放大倍数。
- **Dual-spec 模式:** Dual-spec 可以同时获得近场增强信号和远场拉曼信号, 基于差谱的方法扣除远场拉曼信号, 获得高空间分辨率的 TERS 成像图
- **多变量分析:** 全矩形扫描区域会消耗大量时间, 可以在 AFM 图上选择不规则区域来做成像
- **曲线图:** 力曲线测试反映材料的硬度或者吸附力分布, 力学常数



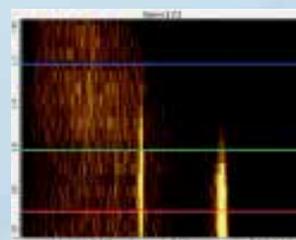
不同区域的拉曼成像图, 背景为 AFM 形貌图



力曲线图, 表征粘附力的分布



金纳米颗粒的 3D 形貌图



光谱曲线, 针尖到样品的距离与拉曼位移

HORIBA NANO Raman 纳米拉曼光谱仪

主要技术参数：

闭环平板扫描器，扫描范围 $\geq 100\mu\text{m} \times 100\mu\text{m} \times 15\mu\text{m}$

闭环压电物镜扫描器，扫描范围 $\geq 30\mu\text{m} \times 30\mu\text{m} \times 15\mu\text{m}$

TERS 分辨率 $\leq 20\text{nm}$ （金基底上氧化石墨烯 -CNT）

同区域成像，一次扫描同时得到 AFM 图像和拉曼成像

多种激光拉曼光谱仪耦合

SmartSPM 原子力显微镜



LabRAM Soleil Nano



LabRAM Odyssey Nano



XploRA Nano



.....

HORIBA

Scientific

www.horiba.com/cn/scientific
info-sci.cn@horiba.com

北京	北京市海淀区海淀东三街2号欧美汇大厦12层 (100080)
上海	上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋一层D单元 (200335)
广州	广州市天河区体育东路138号金利来数码网络大厦1612室 (510620)
成都	成都市青羊区人民南路一段86号城市之心大厦17层C1 (610016)
西安	西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场B栋Win国际2306室
武汉	武汉市江夏区高新大道780号沃德中心905

T: 010 - 8567 9966	F: 010 - 8567 9066
T: 021 - 2213 9150 / 6289 6060	F: 021 - 6289 5553
T: 020 - 3878 1883	F: 020 - 3878 1810
T: 028 - 8620 2663 / 8620 2662	
T: 029 - 8886 8480	F: 020 - 8886 8481

Printed:2021-08/1000